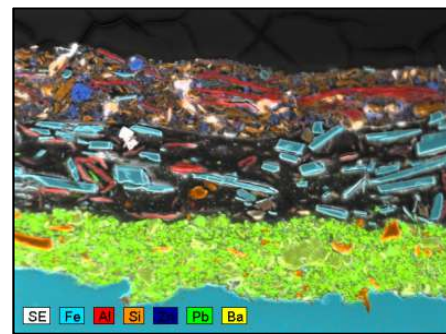
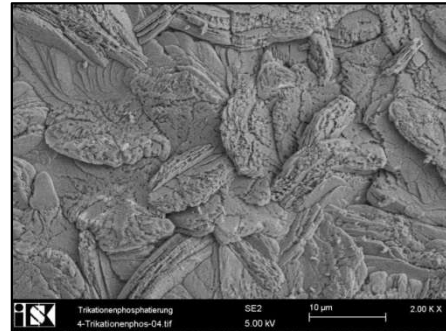


Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop mit EDX-Spektroskopie FESEM / EDX



FESEM Sigma VP, Fa. Carl Zeiss NTS mit EDX-System Quantax 400 und zwei EDX-Detektoren XFlash Detector 5030 der Fa. Bruker Nano GmbH

Modernes Hochleistungssystem zur Untersuchung:

- korrodierter Oberflächen (chemische Zusammensetzung der Korrosionsprodukte oder Beläge, Ermittlung der Schadensursache)
- dünnster Schichten, z.B. Konversionsschichten (Phosphatierung, Chromatierung...), metallischer Überzüge und (Alt-)Beschichtungssysteme
- geschädigter Teile (Risse, Bruchflächen...)
- im VP-Modus **Untersuchung nichtleitender Proben ohne Bedampfung** möglich (Kunststoffe, Beton usw.)